

X射线荧光分析仪

EA1000VX/AIII

HITACHI
Inspire the Next

分析速度更快、操作更简单的X射线荧光分析仪

客户的心声终于转化为有形的产品。

与以往仪器相比，环境管制物质的测量时间大幅缩短。

材料辨识功能、分析线切换功能、清晰易懂的操作面板……

易用性大大提高。

并可用于分析环境管制物质以外的元素。

EA1000VX
高端机型EA1000AIII
标准机型

通过快速测量提高测量效率

与以往机型相比，每个树脂与金属样品的测量时间*均大幅缩短。每天的处理量实现跨越式增长。

| | 塑料中的 Cd、Pb、Hg、Br、Cr | 高浓度Br、Sb塑料中的 Cd、Pb、Hg、Cr | 黄铜中的 Cd、Pb、Hg、Br、Cr |
|------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| EA1000VX | 约30秒 | 120秒以内 | 200秒以内 |
| EA1000AIII | 70秒以内 | 210秒以内 | 800秒以内 |
| SEA1000AII(以往机型) | 约100秒 | 360秒以内 | 2000秒以上 |

*包含统计误差(3σ)达到Cd 20 mg/kg、Pb、Hg、Br、Cr 100 mg/kg以下所需的切换时间。

材料辨识功能

测量开始后，可在短时间内(25秒以下)识别待测样品的材质。

材料大体分为树脂(PE、PVC)、Al合金、Fe合金、Cu合金、Sn合金等。即使不清楚样品的材质，也无需为如何选择分析方法而困惑。

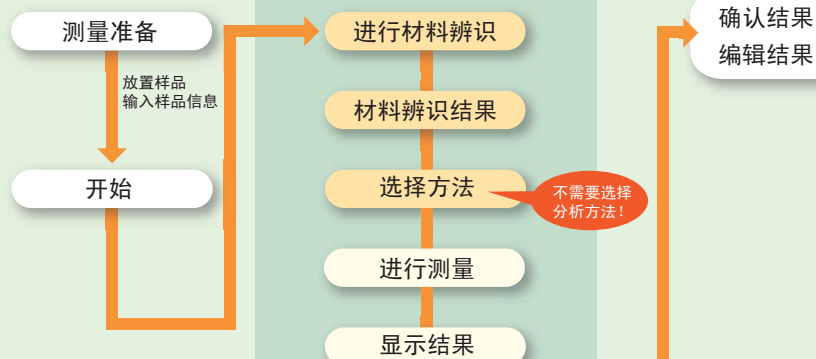
• 材料辨识测量模式

识别待测样品的材料类型，自动选择推荐的分析方法。

• 材料辨识自动测量模式

识别待测样品的材料类型后，自动选择适合的分析方法进行测量，并显示结果。所有步骤实现全自动处理。

材料辨识自动测量流程(例)



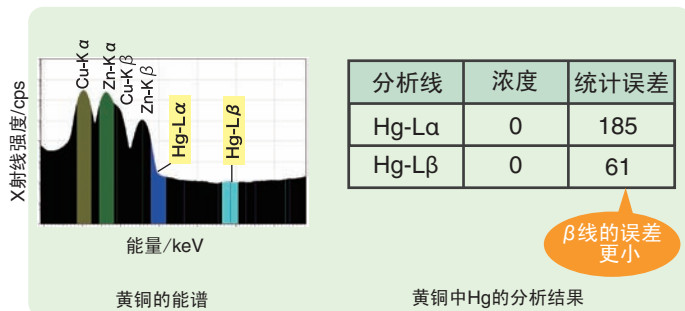


X射线荧光分析仪

EA1000VX/AIII

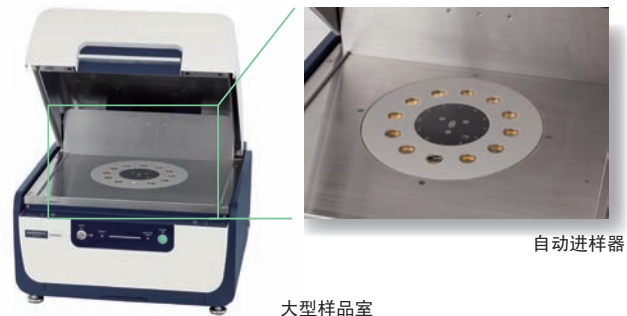
分析线切换功能

本功能是由仪器判断所含元素与波峰的重叠情况，并自动选择统计误差较小的分析线。可以更加有效地管理精度、提高测量效率。



大型样品室与自动进样器(选购项)

大容量样品室可轻松测量大型样品。自动进样器最多可连续测量12个样品，可轻易将微小的样品置于正确的测量位置上。



环境限制物质测量软件Ver.2

- 通过精度管理软件优化测量时间 (Ver.1已有功能)
- 利用数据库对各网点的测量数据进行集中管理 (搜索、浏览、分析、编辑、打印、制作报告)
- 对于之前曾经测过的同一样品，可比较两次的测量结果
- 除了RoHS分析、卤素分析、玩具分析、Sb、Sn分析之外，还可自由添加需要管理的元素

强化测量中的分析功能，
专业分析师也会称心满意！



EA1000VX/AIII

| | | | |
|-------------------------|---|-----------|---|
| 测量元素 | 原子序数13(Al) ~ 92(U) | 定性分析 | 能谱测量、自动辨别、比较表示、KLM标示表示、差异表示 |
| 样品形态 | 固体、粉末、液体 | 定量分析 | 块体校准曲线、块体FP法 |
| 射线源 | X射线管球 (Rh靶材) | 有害物质测量功能 | 环境管制物质测量软件Ver.2、Dbeasy 材料辨识、分析线切换、波峰分离显示功能、波峰标记功能等 |
| 管电压：最大50kV 管电流：最大1000μA | | | |
| 检测器 | 多阴极半导体检测器(EA1000VX) Si半导体检测器(EA1000AIII) | 数据处理 | 配备EXCEL® 配备WORD® |
| 分析领域 | Φ1mm、Φ3mm、Φ5mm (自动切换) | 外形尺寸 | 520(W) × 600(D) × 445(H) mm |
| 样品观察 | 彩色CCD摄像头 | 安装尺寸 | 1500(W) × 1000(D) |
| 滤波器 | 5种模式自动切换 | 重量 | 约60kg |
| 样品室 | 370(W) × 320(D) × 120(H)mm | 使用电源 (主机) | AC100 ~ 240V ±10% 单相 |
| | | | 选购项 |
| | | | 自动进样器 |
| | | | 能谱匹配软件 |
| | | | 薄膜FP软件 |
| | | | 薄膜标准曲线软件 (仅EA1000VX) |
| | | | 各种标准物质 |